

Optional
Function

STEM

for *MacHREM*TM / *WinHREM*TM

Scanning Transmission Electron Microscope
Image Simulation Program

走査型透過電子顕微鏡像 シミュレーションプログラム



GaAs [011] の HAADF 像

このプログラムは走査型透過電子顕微鏡像を計算するもので、高分解能電子顕微鏡像のシミュレーションのためのプログラムである *MacHREM*TM / *WinHREM*TM の拡張機能として追加されたものです。明視野像、暗視野像、さらに最近注目されています高角度散乱暗視野像 (HAADF STEM) を計算することができます。

- 使いやすいユーザインターフェース

初心者でも容易にデータ作成、計算の実行を行う

- 信頼のおけるアルゴリズム

*MacHREM*TM / *WinHREM*TM まで採用されているマルチスライス法

- 高品位な画像出力

にもとづく動力学的散乱計算を基本としています。

Mac OS / Windows の標準画像フォーマットで高品位な濃淡像を生成し、印刷、他のアプリケーションへのコピーが可能です。

お問い合わせ先

有限会社 HREM (HREM Research Inc.)

〒355-0055 埼玉県東松山市松風台 14-48

TEL/FAX 0493-35-3919

email: support@hremresearch.com

